



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	光电探测叠层、半导体此外探测器及其制造方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201110164384.7
申请日期:	2011-06-17
专利号:	201110164384.7
第一发明人:	殷华湘;陈大鹏
实施情况:	授权
专利证书号:	201110164384.7
其它备注:	十室

